

ニッケル水素電池の高容量化 - La-Mg-Ni系合金の元素置換による 局所構造の解明 -

尾崎 哲也

(株) ジーエス・ユアサ コーポレーション

ニッケル水素電池の充放電反応





ニッケル水素電池の負極活物質



AAサイズ(単3形)ニッケル水素電池のエネルギー密度の変遷



La-Mg-Ni系水素吸蔵合金



La-Mg-Ni 系合金の電極特性



本研究の目的

La-Mg-Ni系水素吸蔵合金 LaやNiの一部を異種元素で置換することにより 電極特性(最大放電容量,充放電特性)が大きく変化

放射光X線測定による局所構造解析 置換元素の局所構造・電極特性への影響を考察 高容量でサイクル特性にすぐれる組成の決定





合金作製:高周波誘導溶解 熱処理 (900-1000°C) キャラクタリゼーション

·放射光X線測定 (SPring8 BL19B2 ビームライン)

XRD (波長: 0.7Å または 0.75Å) → Rietveld 解析(解析ソフト: RIETAN-2000)

XAFS (透過法)

・元素分布(EPMA)

・水素吸蔵特性(ジーベルツ型装置)

・電気化学特性(開放形セル)



Mn,AI量の異なるLa-Mg-Ni系合金の相構造



x = 0.15, 0.2のときに5:19H, 1:4R相の割合が増加



Mn,AI量の異なるLa-Mg-Ni系合金の初期サイクル特性

 $La_{0.8}Mg_{0.2}Ni_{3.4-x}Co_{0.3}(MnAI)_{x}$





GS

UASA

Mn,La,Ni,Coの局所構造比較

$La_{0.8}Mg_{0.2}Ni_{3.25}Co_{0.3}(MnAI)_{0.15}$



Mnの第一近接距離は、LaよりNiやCoの方に近い Mnは、NiやCoのサイトに入っていると推定される。

GSYUASA

水素吸蔵前後のLa 周囲の局所構造変化





水素吸蔵前後のNi周囲の局所構造変化





XAFS解析結果から予想される構造モデル

- LaとNiやCoを比べると、Laのサイトの方が、水素化後に構造が 壊れている。
- La-Mg-Ni合金中のユニット構造としてより多い割合で含まれる LaNi₅の構造に注目。

Niのケージの中にLaがおさまっている構造。



Niのケージは維持したまま、Laのまわりに水素が吸蔵される?

Laの一部を他の希土類で置換した場合の放電曲線の変化

$La_{0.64}RE'_{0.2}Mg_{0.16}Ni_{3.45}Co_{0.2}AI_{0.15}$





Laの一部を他の希土類で置換した場合のサイクル特性の変化



Pr, Nd-部分置換合金: 50サイクル後も96%の容量を維持 Ce-部分置換合金: 早期の容量低下



Laの一部を他の希土類で置換した場合の相構造の変化



Pr, Nd 置換: AB₅, 2:7H 相の減少. <u>5:19H</u>, <u>5:19R</u> 相の増加



Pr, Nd部分置換合金におけるAIの置換サイト

5:19R phase





Laの一部をPr または Ndで置換することで c軸方向の空隙が増大する



GSYUASA

Pr, Nd部分置換による積層構造相安定化



AIは積層構造相に固溶しにくいため 積層構造相とAB₅相に分相 積層構造相へのAIの固溶度が増加して AB₅相の偏析が抑制されて合金が均質化



Pr, Nd置換によるサイクル特性向上のメカニズム

La-Mg-Ni系合金においてAB₅相が増加するほど微粉化・腐食が進行しやすい





Ce置換合金のCe-LIII 吸収端 XANES スペクトル





希土類部分置換合金の水素化時の格子体積変化





La-Mg-Ni系水素吸蔵合金のHRTEM像



異なる相が単一の粒子内にc軸方向に連続的に 積層しているポリタイプ積層構造を有している



Ce置換合金のサイクル劣化メカニズム





まとめ

・La-Mg-Ni系合金のNiの一部をMn,AIで置換することにより相構造と電極特性が 大きく変化する、少量置換した場合に5:19H相が安定化して,350mAh/g以上の 高容量で良好な初期サイクル特性をしめす。

水素吸蔵後にLa周辺の局所構造は壊れているが、Ni周辺の局所構造は維持されている、積層構造において、骨格であるNiケージが保持されながらLa周辺の水素が吸蔵されることによって、安定な水素吸蔵放出特性をしめすと考えられる、

・Laの一部をPr,Ndで置換した場合はAB₅相の割合が減少して,サイクル特性が 大幅に向上する.これに対して,Ceで置換した場合は,水素吸蔵によりCeの電子 配置がCe(III)類似からCe(IV)類似へ変化して,結晶相の間で格子の膨張率に差 が生じることが放射光XRD・XAFS解析の結果わかった.膨張率の差によるひず み生成が微粉化の進行・サイクル劣化の原因であると結論付けられた.





本研究は産業技術総合研究所との共同開発において実施しました.放射光 XRDおよびXAFS測定は「SPring8戦略活用プログラム」の支援を受けて実施されました.測定およびデータ解析にあたっては高輝度光科学研究センター 産業利用推進室の杉浦正洽様,本間徹生様,佐藤眞直様,北野彰子様,西 野潤一様,松本拓也様,平山明香様,産業技術総合研究所の松村安行先生 のご指導とご協力を頂きました.また,TEM観察にあたっては広島工業大学 特任教授の北野保行先生のご協力を頂きました.この場をお借りしてお礼申 し上げます.

